

Rastersondenmikroskop

Multimode 8

Prinzip

Oberflächenanalyse. Ortsaufgelöste und *in-situ* Analysen von Probenoberflächen im μm - und nm -Bereich. Messprinzip beruht auf der Wechselwirkung einer Spitze (Sonde) mit der Probenoberfläche.

Hersteller	Bruker
Mode	Multimode 8
Abbildungstechniken	AFM, STM, EC-STM, SECPM
Umgebungsbedingungen	Luft, Flüssigkeit
Temperatur	Raumtemperatur
Max. Scanbereich	$10 \times 10 \mu\text{m}^2$
Max. vertikaler Bereich	$2,5 \mu\text{m}$
Sonderausstattung	Bipotentiostat für <i>in-situ</i> Messungen in Flüssigkeiten
